

Suche

Quantitative characterization of oxygen in czochralski silicon by secondary ion mass spectrometry

Gara, Stefan

1991

[Standorte](#)[Details](#)

Titel:	Quantitative characterization of oxygen in czochralski silicon by secondary ion mass spectrometry
Verfasserangabe:	von Stefan Gara
Person/Institution:	Gara, Stefan
Erscheinungsjahr:	1991
Umfangsangabe:	XI, 174 Bl. : Ill., graph. Darst.
Beschreibung:	Zsfassung in dt. Sprache
Hochschulschrift:	Wien, Techn. Univ., Diss., 1991
Sprache:	Englisch
Schlagwörter:	Silicium ; Sauerstoff ; Sekundärionen-Massenspektrometrie
TU Wien Systematik:	CHE:200 CHE:
Zitierlink:	http://katalog.ub.tuwien.ac.at/AC00277614
AC-Nummer:	AC00277614
Quelle:	TU Wien Online Katalog

